

# 台灣技術交易資訊網 專利/技術流通快報

電子報主題			
半導體測試設備專利組合			
專利/技術簡介			
<p>本半導體測試設備專利組合為 8 案 26 件之已獲証發明專利，為京元電子所有，佈局國家包含 TW、CN、US、JP、KR，包含半導體測試設備相關之專利。</p> <p>本專利組合技術主要是與半導體測試相關之設備/裝置，包含具隔熱鏡片組之測試設備、輸送裝置、分料裝置、容器轉換裝置、供料裝置、往複式取放設備等，可改善等待問題、解決毛邊及卡料問題，並增加產能、減少成本、提高效率，大幅改善晶片封裝後進行測試時之作業時間及效率。</p>			
專利/技術效益(應用領域)			
<p>本專利組合為有關於半導體測試設備之技術，解決多種習知問題，可應用於半導體測試產業。</p>			
專利/技術發展現況			
<p>在半導體供應鏈中，IC 測試業雖屬後段服務，卻是 IC 製造流程中重要的一環，一般可分兩個階段，其中在切割、封裝前的測試為 IC 晶圓測試(Wafer Test)，其目的在針對晶片做電性功能上的測試，使 IC 在進入封裝前能先行過濾出電性功能不良的晶片，以降低 IC 成品的不良率，減少製造成本的耗費；而封裝成形後的測試為 IC 成品測試(Final Test)，其目的在確認 IC 成品的功能、速度、容忍度、電力消耗、熱力發散等屬性是否正常，以確保 IC 出貨前的品質。對 IC 製造廠商而言，測試實為一不可缺少之關鍵製程，目前尚無可替代之產品或勞務。</p> <p>全球成品測試概分為 Logic、Processors、Memory 及 Analog 等四大類型。隨著全球 IDM 大廠將測試產能委外的發展趨勢逐漸明顯，測試業技術挑戰性越來越高，發展空間也加大。1 顆 IC 的形成，包括設計、生產製造、封裝到測試，在半導體供應鏈分工過程中，測試是最後階段的工程服務，但在結合前段設計、生產製造及後段封裝的一貫化服務策略下，測試業逐漸發展成為具競爭力的分工夥伴。</p>			
相關專利清單			
核准國	專利申請號	專利名稱	專利起訖期
TW	096107169	具隔熱鏡片組之測試設備	20101211~20270301
US	11/819,083	HEAT-RESISTANT LENS KIT	20100420~20270624
JP	特願 2007-222456	断熱レンズセット	20110422~20270829
TW	096121925	匣盤輸送裝置	20101201~20270614
CN	200710127404.7	匣盤輸送裝置	20101027~20270704
US	11/852,095	Tray Transportation Device	20091117~20270906

TW	097126335	分料裝置	20111021~20280710
CN	200810134901.4	分料裝置	20110615~20280728
US	12/410,332	SEGREGATING APPARATUS	20111129~20290323
JP	特願 2008-201719	分料裝置(SEGREGATING APPARATUS)	20110826~20280805
TW	094135156	供料裝置	20070121~20251006
CN	200510118533.0	供料裝置	20081022~20251026
US	11/280,279	Feeding apparatus of test equipment	20110510~20251116
JP	特願 2005-337381	供料裝置(FEEDING DEVICE)	20090501~20251122
TW	095124808	半導體構裝元件之容器轉換裝置	20081011~20260706
CN	200610105797.7	半導體構裝元件之容器轉換裝置	20110420~20260724
US	11/512,275	TRAY TO TUBE MANUAL EXCHANGER	20081125~20260829
JP	特願 2006-252831	半導體構裝元件之容器轉換裝置(VESSEL REPLACING DEVICE OF SEMICONDUCTOR PACKAGE)	20091120~20260919
KR	10-2006-0083229	TRAY TO TUBE MANUAL EXCHANGER	20071002~20260830
TW	097122210	分料機構	20111221~20280612
CN	200810125373.6	分料機構	20101208~20280619
TW	097120466	往復式取放機構裝置	20111221~20280601
CN	200810109482.9	往復式取放機構裝置	20110413~20280611
TW	094125029	電子元件測試裝置	20070311~20250721
CN	200510090554.6	電子元件測試裝置	20090617~20250817
JP	特願 2005-299014	電子部品テストシステム	20110729~20251013

流通方式：

一般授權    專屬授權    讓與    合作開發    面議

聯絡窗口：

台灣技術交易資訊網,廖小姐 03-5917711,fion@itri.org.tw